

ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЕ ОСТОВНО-ВАЛЕНТНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В КРИСТАЛЛАХ CsCl и CsCaCl_3

*E. N. Мельчаков, П. А. Родный, Б. В. Рыбаков,
А. Я. Смаков, М. А. Терехин*

Новый вид собственной люминесценции ионных кристаллов, обнаруженной во фториде бария [1], активно исследуется в последнее время [2–6]. Основная особенность люминесценции — отсутствие возбуждения в области $h\nu_i \approx E_{g1}$, т. е. при энергиях падающих квантов, близких к ширине верхней запрещенной зоны кристалла E_{g1} . Порог возбуждения люминесценции соответствует энергетическому зазору E_{cc} между основной зоной и зоной проводимости кристалла; для BaF_2 $E_{cc}=18$ эВ [3]. Кванты излучения создаются при рекомбинации электронов *p*-оболочки фтора с дырками во внешней оболочке иона бария [3, 4], что соответствует переходам дырок из верхней основной ($5p$, Ba^{2+}) зоны в валентную зону ($2p$, F^-), т. е. основно-валентным переходам (ОВП). Модель излучательных ОВП находится в стадии развития, поэтому представляет интерес ее проверка на других кристаллах.

В настоящей работе исследовались свойства собственной люминесценции кристалла CsCl , для которого имеются некоторые экспериментальные результаты [5, 6], и менее изученного соединения CsCaCl_3 . Спектры рентгенолюминесценции (РЛ) измерялись при временном интервале 10 нс, нижний порог измерения кинетики РЛ был на уровне 1 нс [7], температурный диапазон 77–850 К. Спектры возбуждения люминесценции измерялись с помощью источника синхротронного излучения Сибирь-1 [8] в области $h\nu_i=6\div30$ эВ.

Для излучательных ОВП характерны высокая температурная устойчивость и субнаносекундное время высыпчивания [4]. В CsCaCl_3 интенсивность РЛ $I_{\text{РЛ}}$ оставалась практически постоянной при $T=77\div850$ К, а время спада было меньше 1 нс. В CsCl зависимость $I_{\text{РЛ}}(T)$ носила более сложный характер: при нагревании образца от 77 до 250 К $I_{\text{РЛ}}$ уменьшалась приблизительно в 2 раза, а при $T > 250$ К оставалась постоянной. Время высыпчивания CsCl при 295 К составляло 1.5 ± 0.5 нс. Возможно, в случае CsCl на полосы ОВП накладывается излучение синглетных экситонов.

Спектры собственной РЛ кристаллов представлены на рис. 1. Положение низкоэнергетического края полосы люминесценции, связанной с ОВП, определяется зазором между верхней основной и валентной зонами, т. е. шириной второй запрещенной зоны кристалла $E_{g2} = E_{cc} - (E_{g1} + \Delta E_v)$. Из энергетической схемы (рис. 2, a), построенной на основе обобщения данных [4, 9], следует, что ширина полосы излучательных ОВП должна быть близкой к ширине валентной зоны ΔE_v . Кроме того, полоса люминесценции должна попадать в область прозрачности кристалла ($E < E_{ex}$). В результате получим условие

$$E_{g2} \leq h\nu_r \leq (E_{g2} + \Delta E_v) < E_{ex}. \quad (1)$$

Здесь $h\nu_r$ — энергия квантов ОВП, E_{ex} — энергия создания анионных экситонов. Для CsCl , согласно наиболее точным данным по фотоэлектронной спектроскопии [9], имеем $E_{cc}=14.1$, $E_{g1}=8.3$, $\Delta E_v=1.8$ эВ, что приводит к значению $E_{g2}=4.0$ эВ. В CsCaCl_3 указанные параметры не должны сильно отличаться, поэтому условие регистрации ОВП (1) в кристаллах выполнено (в CsCl $E_{ex}=7.85$ эВ, в CsCaCl_3 $E_{ex}=8.08$ эВ [10]). Излучение CsCl должно лежать в пределах 4.0–5.8 эВ, что согласуется с экспериментальными данными (полоса 3.2 эВ, отмеченная в [6], не зарегистрировалась).

Полученный спектр возбуждения CsCl (кривая 3 на рис. 1) имеет лучшее разрешение, чем в [5, 6], и коррелирует со спектром отражения (кривая 5), для которого определены переходы, ответственные за регистрируемые пики [11]. Энергия 13.3 эВ первого экситонного пика Γ_{15} ($5p, j=3/2 \rightarrow \Gamma_1$ ($6s$)) меньше порога возбуждения, отсюда следует, что для возникновения ОВП необходимы межзонные переходы. Переходы осуществляются с уровней оставной ($5p, Cs^+$) зоны на различные уровни (Γ_1, Γ_{12}) зоны проводимости, поэтому ширина полосы возбуждения больше ширины оставной зоны кристалла. Соответствие порога возбуждения и энергетического зазора $E_{ce} = 14.1$ эВ служит доказательством принадлежности регистрируемой люминесценции CsCl (точнее,

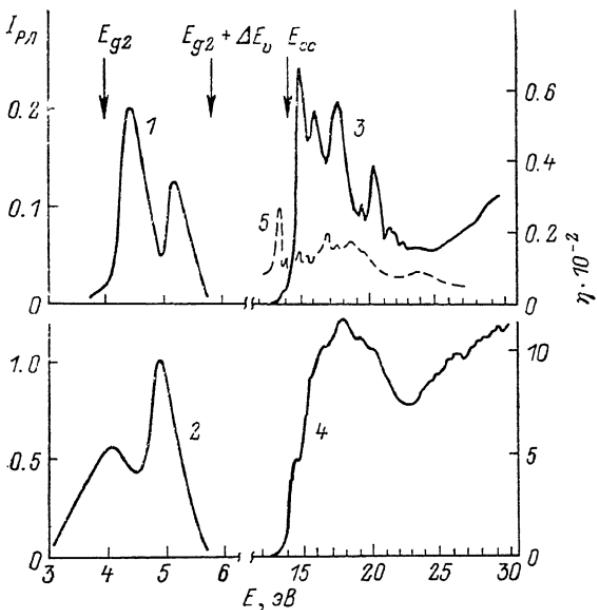


Рис. 1. Спектры кратковременной РЛ (1, 2) и возбуждения люминесценции (3, 4) кристаллов CsCl (1, 3) и CsCaCl₃ (2, 4).

η — квантовый выход относительно салицилата натрия. Спектр отражения CsCl (5) [11] ($T=295$ К).

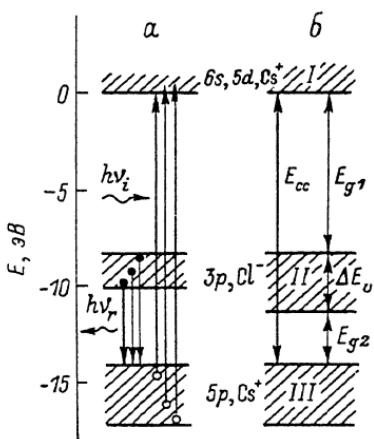


Рис. 2. Схема энергетических зон кристаллов CsCl (a) и CsCaCl₃ (b).

I — зона проводимости, II — валентная, III — оставная.

большей ее части) к ОВП. Из спектра возбуждения люминесценции CsCaCl₃ (кривая 4) следует, что положение оставной зоны почти не изменяется при переходе от CsCl к CsCaCl₃. Таким образом, для ОВП спектр люминесценции отражает положение и структуру валентной зоны, а спектр возбуждения — верхней оставной зоны кристалла. Такие люминесцентные данные особенно полезны в случае отсутствия более сложных фотоэмиссионных экспериментов. Спектр РЛ CsCaCl₃ (кривая 2) позволяет оценить ширину валентной зоны и ее положение относительно потолка оставной зоны кристалла (рис. 2, б).

Интенсивность люминесценции CsCaCl₃ при рентгеновском возбуждении (295 К) была примерно в 6 раз, а при $h\nu_i \approx 18$ эВ более чем на порядок выше, чем кристалла CsCl (подобный эффект отмечен при переходе от KF к KCaF₃ [12]). В CsCl ион Cs⁺ окружает 8 ионов Cl⁻, а в CsCaCl₃ (структура первовскита) — 12 ближайших ионов Cl⁻. В результате вероятность перехода с переносом заряда $3p, Cl^- \rightarrow 5p, Cs^+$ в CsCaCl₃ выше, что приводит к увеличению интенсивности люминесценции. В рамках зонных представлений можно полагать, что введение дополнительного катиона усложняет структуру валентной зоны и увеличивает число разрешенных переходов, а также их вероятность.

Собственная люминесценция CsCaCl_3 , и в значительной мере CsCl связана с остоянно-валентными переходами, поскольку наблюдаются неравенство (1) и другие необходимые условия: $h\nu_i \approx E_{ce}$, $\tau \leqslant 1$ нс, высокая температурная устойчивость излучения.

Список литературы

- [1] Родный П. А., Иванов В. А. // Тез. докл. VIII Всес. конф. по спиритилляторам. Харьков, 1981. С. 67–68.
- [2] Ершов Н. И., Захаров Н. Г., Родный П. А. // Опт. и спектр. 1982. Т. 53. № 1. С. 89–93.
- [3] Александров Ю. М., Махов В. Н., Родный П. А., Сырейщикова Т. И., Якименко М. Н. // ФТТ. 1984. Т. 26. № 9. С. 2865–2867.
- [4] Головин А. В., Захаров Н. Г., Родный П. А. // Опт. и спектр. 1988. Т. 65. № 1. С. 176–180.
- [5] Aleksandrov Yu. M., Makhov V. N., Syrejshchikova T. I., Yakimenko M. N. // Nucl. Instrum. and Methods. 1987. V. A261. N 2. P. 153–155.
- [6] Kubota S., Itoh M., Ruan (Gen) J., Sakuragi S., Hashimoto S. // Phys. Rev. Lett. 1988. V. 60. N 22. P. 2319–2322.
- [7] Родный П. А. // Аппаратура и методы рентгеновского анализа. Л.: Машиностроение, 1989. В. 39.
- [8] Бельский А. Н., Колобанов В. Н., Михайлин В. В., Рыбаков Б. В., Терехин М. А. // Опт. и спектр. 1987. Т. 62. № 3. С. 590–592.
- [9] Smith J. A., Pong W. // Phys. Rev. B. 1975. V. 12. N 12. P. 5931–5936.
- [10] Волошиновский А. С., Пашук И. П., Пидзырайло Н. С. // Укр. физ. журн. 1985. Т. 30. № 6. С. 851–853.
- [11] Rubloff G. W. // Phys. Rev. B. 1972. V. 5. N 2. P. 662–684.
- [12] Валбис Я. А., Рачко З. А., Янсонс Я. Л. // Опт. и спектр. 1988. Т. 64. № 5. С. 1196–1197.

Ленинградский политехнический
институт им. М. И. Калинина
Ленинград

Поступило в Редакцию
25 октября 1988 г.

УДК 539.21 : 537

Физика твердого тела, том 31, в. 5, 1989

Solid State Physics, vol. 31, № 5, 1989

ИОННЫЕ ТОКИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ЗАРЯДОМ, В ТВЕРДОЭЛЕКТРОЛИТНЫХ ПЛЕНКАХ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛИТИЯ

Е. С. Нимон, А. В. Чуриков, А. А. Сенотов, А. Л. Львов,
А. Н. Чувашкин

На поверхности литиевого электрода, находящегося в контакте с неводным электролитным раствором, образуются пассивирующие пленки, обладающие свойствами твердого электролита — относительно высокой ионной и низкой электронной проводимостью [1, 2].

В настоящей работе проводились исследования ионного транспорта в твердоэлектролитных пленках (ТЭП), которые формировались на поверхности лития в одномолярных растворах LiAlCl_4 в тионилхлориде (TX) и LiClO_4 в смеси пропиленкарбоната (ПК) с диметоксиэтаном (ДМЭ). В первом случае образовывались поликристаллические пленки на основе LiCl , а во втором случае — поликристаллические пленки на основе Li_2CO_3 [1].

Использованные в настоящей работе объекты весьма удобны для изучения особенностей ионного транспорта в твердых электролитах, которые находятся в контакте с электродами, представляющими собой резервуар ионных носителей. Кроме того, исследования ионного переноса в системе литий—ТЭП—неводный раствор представляют значительный